

一般社団法人 日本非破壊検査協会

平成30年度非破壊検査総合シンポジウム

スケジュール (案)

期 日：平成30年6月6日(水)～7日(木)

会 場：(一社)日本非破壊検査協会 亀戸センター
(東京都江東区亀戸2-25-14 立花アネックスビル6階)

第1日目 6月6日(水)

開 会 式	9:20～9:30
イ ベ ント	9:30～17:05
特別講演	17:15～18:15
懇 親 会	18:30～20:30

開会の挨拶 9:20～9:30
(会場：第1会場)

第1会場：《RT 部門及びAE 部門》

10:00～11:00 X線と中性子線によるイメージングの特徴と相補利用(1)
11:10～12:00 X線と中性子線によるイメージングの特徴と相補利用(2)
13:30～17:00 IoTに資するAE技術と我が国発のAEの国際規格(ISO)
17:15～18:15 特別講演

第2会場：《MT/PT/VT・ET/MFLT・LT 部門合同》

10:00～11:50 表面NDTワークショップ(1)
—若手研究発表—
13:00～13:50 表面NDTワークショップ(2)
—Keynote Lecture—
14:00～15:45 表面NDTワークショップ(2)
—討論/表面探傷における研究課題—

第3会場：《MI 部門・TT 部門》

9:30～10:10 $\cos\alpha$ 法及び二次元X線検出器によるX線応力測定(1)
10:20～11:20 $\cos\alpha$ 法及び二次元X線検出器によるX線応力測定(2)
11:30～12:30 $\cos\alpha$ 法及び二次元X線検出器によるX線応力測定(3)
13:30～14:50 赤外線計測とその周辺技術
—赤外線計測Ⅰ—
15:00～16:00 赤外線計測とその周辺技術
—赤外線計測Ⅱ—
16:05～17:05 赤外線計測とその周辺技術
—招待講演—

懇 親 会 18:30～20:30

会場：アンフェリシオン
江東区亀戸1-43-22
03(5836)5111
(<http://www.anfelicion.jp/access/>)

第2日目 6月7日(木)

イ ベ ント	9:00～13:00
社員総会	14:00～16:30

第1会場：《UT 部門》

10:00～13:00 超音波探傷試験の信頼性

第2会場：《SSM 部門》

9:00～10:40 応力・ひずみ測定と強度評価

* 参加申込をされる方は、協会ホームページ
(http://www.jsndi.jp/sciences/index2_1.html)の
WEB参加受付からお申し込みください。

【会場案内図】

一般社団法人 日本非破壊検査協会 亀戸センター

JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」下車、北口より徒歩 約5分

